



# CDE ResMap 463-FOUP

## 抵抗率測定装置

### 4 探針法・自動

ResMap463-FOUP は、300 mm 大量生産のニーズを満たすために設計されたモデルです。CDE 社が特許取得した探針チェンジャーを搭載し、2 探針構成、4 探針構成の何れかで使用可能です。この独自の特長をもつ最も費用対効果に優れた導電性薄膜測定用 4 探針法測定装置測定装置です。200 mm と 300 mm のオープンカセットに対応するアダプターも備えています。

### Specifications

ウエハ搬送方法	300mm FOUP mini-environment dual(2)或いはquad(4)プ ローブチャンバー	エッジ除外 (最小)	1.5mm (プローブ中心から基板端まで)
ウエハサイズ	300mm 自動搬送 200mm、300mmのオー ンカセットに適應 手動であれば全てのサイ ズに対応	コンピューター システム	Computer CPU 3.2GHz I3, 4GB memory, 1TB hard drive, operating system: Windows XP
最大径	15インチ(381mm)	SECS-II オプション	可能 300mm工場自動化可能
最大角	10.5インチ(267mm)□	POD-ID オプション	RF ID
標準測定時間	1点あたり1秒	マッピングパターン	円形マッピング (ノッチ/フラットに合 わせる或いはフラットに沿う)、長方形 マッピング、ラインスキャン (直径、半 径、または直径に沿った任意の2点間、最 小間隔0.1 mm)、ユーザーにて定義可能 (テンプレート)
標準ウエハ搬送時間	8秒	プロット	等高線 (間隔選択、1/3σ, 固定および自 動)、3D、直線、データマップ、ヒストグ ラム、データシーケンス、半径方向およ び角度方向分布、各種モードのトレンド チャートが使用可能
標準ノッチ検出時間	5秒 (標準のノッチ検 出)	データ	ResMapのデータファイルはすべて分析用 にエクセル等のプログラムへ書き込みが 可能
最大スループット	35 wph (ノッチ検出含む) (49点)	<b>Facilities</b>	
測定範囲	1 mΩ/sq- 10MΩ/sq (1 mΩ/sqに最適化可能)	工場側真空	>500mmHG (チューブ径 : 1/4インチ)
再現性	静止状態: ≤±0.02% 可動状態: ≤±0.1% (near by spots, typical)	電源	100V ~ 240V < 10 KVA
精度	≤±0.5% NIST規格による	寸法(幅×奥行×高)	22"× 44"× 60" (558mm×1117mm×1524mm)

**NTE**

NAGASE Group

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

Creative Design Engineering, Inc.  
20565 Alves Drive, Cupertino, CA 95014 USA  
Tel: +1-408-366-2626 Fax: +1-408-366-2882  
www.CDE-ResMap.com

Rev. 150219